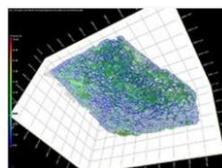
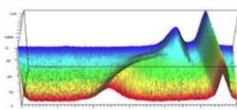
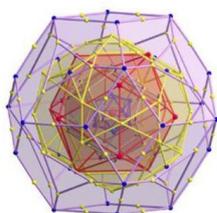


Offre de prestation

Diffraction des rayons X, Spectroscopie Mössbauer, Tomographie



VOS BESOINS

- Des outils de caractérisation des matériaux par différentes techniques d'analyse de structure et/ou microstructure
- Des mesures de contraintes résiduelles et de textures
- Des mesures d'environnement chimique reconstruire le volume d'un objet
- Une technique d'imagerie X non destructive en transmission.

COMPÉTENCES PROCHES

- Analyse structurale et microstructurale par microscopie électronique (MEB, MET)
- Dépôt et caractérisation de couches minces sous ultra vide (Tube D.A.U.M.)

NOS SOLUTIONS

- Déterminer les phases et effectuer leurs quantifications dans un échantillon pulvérulent ou massif
- Déterminer les contraintes résiduelles / textures dans un échantillon massif ou sous formes de couches minces
- Mesurer la réactivité d'un matériau en fonction de la température (77K à 1200°C) et de l'atmosphère (oxydo-réductrice, neutre ou sous vide)
- Déterminer les épaisseurs de films minces par réflectométrie
- Déterminer la composition chimique par fluorescence X
- Former aux techniques de caractérisation des matériaux (mesures et traitements de données au moyens de logiciels spécifiques)
- Nos offres sont éligibles au Crédit Impôt Recherche

NOS RÉFÉRENCES

MOTS-CLÉS

Caractérisations, Rayonnements X, Radiations, Cr, Co, Cu, Mo, W, 57Co, 119Sn, Poudre, Film mince, Monocristal, Polymère

CONTACT

- Contact équipe :

 p.boulet@univ-lorraine.fr

 +33 3 72 74 25 18

- Contact TTO, service dédié aux relations entreprises :

 ijl-tto@univ-lorraine.fr

 +33 3 72 74 26 04